単一分子エレクトロニクスとその集積化



小川琢治*

Single molecular electronics and their integration Key Words : single molecular electronics, self assembly, carbon nanotube, single molecular magnet

単一分子に一つの電子機能を持たせ、それらを集積 することでより高次の電子機能を発現させる事を目 指した研究を行っている。この研究を行うためには、 (1)分子構造とその電子機能の関連を明らかにする、 (2)分子を集積化する方法の開発(有機合成的手 法と自己組織化的手法)、(3)カーボンナノチュー ブや金属ナノロッド・ナノ粒子のような無機ナノ構 造体との融合の研究が必要であると考えている。こ れらの3点について、ここ1年くらいの研究の展開 を中心に振り返ってみたい。(図1)

(1)分子構造とその単一分子電子機能

単一分子の電気特性を計測する手法としては、機 械的破断法 (Mechanical Break Junction, MBJ) が、 標準となった。^{1,2} 微細な金属電極を横方向に破断 する手法と、従来の走査トンネル顕微鏡 (Scanning Tunneling Microscopy, STM)を利用して、金属針 と金属基板の間の接合の間に分子をトラップする方 法がある。前者の方が接合が安定になり、様々な条 件下での計測が可能になる。後者は、安定性に欠け るが、単純に一分子の伝導度を測定するには手軽な 方法である。いずれも、金属のナノワイヤーを機械 的にピエゾ素子を利用して引き延ばすと、切れる直 前に原子レベルの直径の接合ができ、その接合を通 した電気特性の計測が可能になることを原理として



*Takuji OGAWA 1955年11月生 京都大学大学院理学研究科化学専攻 (1984年) 現在、大阪大学大学院理学研究科化学専 攻 教授 理学博士 有機化学・ナノ科 学 TEL:06-6850-5392 FAX:06-6850-5395 E-mail:ogawa@chem.sci.osaka-u.ac.jp



Molecular Circuits

図1. 単一分子素子 (molecular parts) をつなげた単一 分子集積回路 (molecular circuits) の概念図

いる。金属ナノワイヤーの周辺に分子が存在してい ると、金属が破断した後に分子の接合ができるので、 数分子~単一分子の電気特性計測が可能になる。通 常の測定では、数千回ナノワイヤーの切断と融合を 繰り返し、その伝導度の1次元ヒストグラムを作成 することで、単一分子の伝導度を決定している。³

MBJ 法以外にも、STM による Single Tunneling Spectrocopy (STS) を使った単分子電気伝導計測の 研究も多い。MBJ 法では電極と分子を共有結合で つなぐことができるが、STM では分子と電極の間 は共有結合でつながっていない。MBJ でも、共有 結合でつながらない計測も行われているが、例えば S-Au の共有結合よりも、金属-π電子の相互作用の ほうが大きい事もあり、測定法の違いよりも、分子



図2. これまでの単一分子電導研究のほとんどがトンネル電導しか扱って いなかった。分子のレドックスが現れることで高機能単一分子素子の実現 が可能になる。

と電極の相互作用の大きさが電気特性に大きく影響 を与える。³

単一分子電気伝導において最も単純な現象は、分子を通してのトンネル伝導であり、基本的には分子 の状態密度に関係した電流 - 電圧 (*I-V*)特性が得ら れる。しかし、これだけでは基本的には対称で単調 増加の I-V が得られるだけで、それほど面白い現象 は期待できない。分子が関与することで、分子のレ ドックスや構造変化に伴った電気特性の変化が現れ ると、様々な興味深い現象が期待できる。これらの 現象は、伝導電子が分子内に一度留まり、分子の電 子状態を変化させると起こると期待でき、単純なト ンネル伝導とは異なる。4 (図 2)

様々な興味深い現象が報告されているが、その中 でも磁性にかかわる単一分子伝導に興味を持ってい る。現在のハードディスクなどは、磁気を記憶に用 いており、メモリーも磁気を使うとその保持にエネ ルギーを使わずにすむ。しかし、通常の磁性体では、 磁気を保持する単位が(数+nm)³程度と大きく、 これ以上の微細化は原理的に不可能である。しかし、 分子は一分子で磁性を保持するものがある(単一分 子磁石)ため、これが利用できると原理的には 1nm³以下にまで記憶単位を小さくすることが可能 になる。単一分子磁石を用いた分子スピントロニク スの研究例はレビューを参照いただきたい。⁵ 単一分子磁石として古くから知られているものに、 Mn12 錯体がある。これは Mn のスピン同士が分子 内で共同的に働くことで、強磁性を示すものである。 石川らは、Tb などのランタノイドのフタロシアニン・ ダブルデッカー錯体が単一分子磁石としての性質を 示すことを見出した。⁶⁸ これは、スピンをもつイ オンが一つしかないのに、単一分子で強磁性を示す 驚くべき分子である。

この分子を用いて、STM で局在スピンの制御を 試みた実験がある。ラジカルの存在は観測されるが、 残念ながら Tb 由来のスピンでは無く、フタロシア ニン由来のπラジカルによるものであった。^{9,10}

Tb フタロシアニン・ダブルデッカー錯体と、グ ラフェンやカーボンナノチューブなどのナノ炭素材 料を組み合わせて、スピンバルブとしての働きをさ せることにも成功している。^{11,12} しかし、スピン バルブが見られるのは、0.04Kという極低温におい てのみだけである。分子自体の単分子磁石性は、40 ~50Kで見られるので、なぜ極低温でしかスピン バルブが見られないのかの理由は明らかで無い。

われわれは、最近、Tb ポルフィリン・ダブルデ ッカー錯体が、ポルフィリン環の中心にプロトンが 一つついた形状では単分子磁石性を示さないが、プ ロトンが取れたアニオン体では単一分子磁石性を示 すことを見出した。¹³ これにより、プロトンの脱



図3. Tb ポルフィリン・ダブルデッカー錯体の単分子磁石性。プロトン体では、 単分子磁石性 (SMM) が無いが、アニオン体では発現する。

着により磁性のスイッチングができることになる。 (図3) この発見の重要な点は、電場や光などの何 らかの外部刺激によりプロトンの脱着が可能になれ ば、それにより分子の電子状態が大きく変わり、そ れに伴い伝導特性も大きく変わる可能性があること である。プロトン体、脱プロトン体とも安定で外部 刺激で往復可能な分子系ができれば、単一分子でメ モリーが可能になる。

これ以外の分子でも、単一分子の磁気効果については、興味深い報告が多く出ている。

単一分子を通しての巨大磁気抵抗。巨大磁気抵抗 は、金属性で非磁性のスペーサーで分けられたフェ ロ磁性構造において起こる。金属の代わりに分子な どの絶縁体を用いると、トンネル磁気抵抗が見られ、 磁気抵抗比は大きくなるが抵抗の絶対値も大きくな る。フタロシアニンをCu(111) 基板上のCo島構造 体に乗せ、Coコートしたタングステンのチップを 用いたSTMで計測し、60%の磁気抵抗と0.26Goと いう高い伝導性が実現できた。これは、分子 - 電極 金属軌道の混成がスピン依存であるためと分かった。 この実験は、単一分子を用いると、大きな磁気抵抗 効果と高電導性が両立できる事を示しており、興味 深い。¹⁴

外部刺激、特に電流や電界で、磁気特性が変化で きる分子は、興味深く、既にいくつかは報告がある。 しかし、これらの分子に対する電場の影響は、極端 に小さかったり、制御が困難であったりした。この 論文では、磁気的な混合原子化状態の2量体におけ るスピンを電場で制御する研究を取り扱っている。 [(PY5Me₂)₂V₂(μ -5,6-dimethylbenzimidazolate)](PF₆)₄ 錯体は、S=5/2の高スピン基底状態(HS)と、S=3/2 および S=1/2 の低スピン励起状態 (LS) を持ってい るが、励起状態は、それぞれ基底状態よりも 100、 300cm⁻¹ エネルギーが高いだけである。この分子を 用いた計算機実験を行ったところ、0.05~1 V/nm の電界で基底状態のスピン状態を HS から LS へ入 れ替えることが可能であることが分かった。これに より、充分に実用的な電圧で、単一分子スピンメモ リが可能であることが示されたと言える。¹⁵

Fe(1,10-phenanthroline)2(NCS)2分子は、175K に転移点を持ち、低温側でS=0のLS状態、高温側 で S=2の HS 状態を持つ、スピンクロスオーバー錯 体である。Cu(100) 表面に CuN 層を導入することで、 STMの電流でHS-LSの転移が可能になる。Cu(100) 表面で STM 観察すると、二つのフェナントロリン ナントロリンが見えるが、その距離が異なる2種類 がある。STSの研究により、ローブ間の距離が遠い ものが HS で、近いものが LS とわかった。Cu(100) に CuN を一層乗せた基板で観察すると、高さが中 央付近でやや高い α 型とへこんでいる β 型がある。 これも、STS で、 α が HS、 β が LS と分かった。 分子上で、電圧をサイクリックスキャンすると、電 流がヒステリシスを示すことが分かり、HSとLS の間の切り替えが可能であること、かつそれぞれの 状態で伝導度が異なることが明らかとなった。これ により、単一分子メモリが実現できたといえる。16

(2)分子を集積化する方法の開発

単一分子電子素子の集積化により、どのような機 能を実現するかについての方向性の提案には次のよ うなものがある。(a) 集積化により NAND や NOR のようなロジックゲートを作り、それを使って現有 のシリコン電子回路に代わるものを目指す。(b) 確 率共鳴素子のように、生物が用いている情報処理を まねた系を目指す。(c) セルラーオートマトンによ る情報処理を目指す。量子セルラーオートマトン (QCA)として以前から提案されている、2 安定状 態系を2次元に広げた系を、具体的な分子を用いて 量子化学計算により検討した論文が最近も出ている。 17

具体的にどのようにして分子を並べるのかという 方法は、有機合成的手法により共有結合でつなげて いく考え方と、物理的相互作用を使って自己組織化 的につなげていく考え方がある。自己組織化による 作成は、手法としては容易であるが設計、予想が困 難であることが難点となっている。これについて「2 次元結晶工学」ととらえて、設計可能にしようとの 仕事がいくつか出ている。

HOPG や、金属単結晶表面上での2次元超構造 を決定する因子としては、(a) 基板との相互作用、 (b) 溶媒、(c) 基質濃度、(d) 分子間相互作用などが あり、いくつかの分子においては、ある程度思い通 りの超構造体を作ることが可能になっているが、¹⁸ 一般的にはまだまだ困難である。

Alkoxylated dehydrobenzo annulene (DBAs) は、 最密充填構造である直線構造(ラメラ構造)とヘキ サゴナル構造の2種類の超構造を示す。この結果は、 吸着 - 脱着過程の熱力学パラメーターで説明されて いる。¹⁹

1,3,5-benzenetribenzoic acid (BTB) と 1,3,5-tricarboxybenzene trimesic acid (TMA) のそれぞれの濃度 を変えて、表面上の超構造を観察すると、6 種類の 構造ができる。²⁰ この現象も、やはり熱力学パラ メーターを仮定することで説明されている。これら 二つの説明の仕方をまとめると、i) パターンは、分 子 - 分子、および分子 - 基板の単位面積当たりの相 互作用が最大になるように形成される、ii) 分子の 濃度が下がると、単位面積当たりではない全相互作 用エネルギーの最大化が、パターン形成の駆動力と なる。²¹

上記二つの例では、いずれもアルキル鎖は基板上 に寝た構造をとっている。これまでの常識では、ア ルキル鎖が基板上に寝た構造が最も安定であると考 えられてきた。このような系では、上記のように各



R=C_nH_{2n+1} (n=12, 14, 16, 18, 20)



NDI-C,



図4.2次元超構造の実験に用いられた分子の構造

相互作用エネルギーをパラメーター化することで、 半定量的な超構造の説明が可能になってきている。 しかし、最近になって必ずしもアルキル鎖が基板上 に寝ていない安定構造が報告され始めた。これは、 どのように説明できるのだろう?

N, N'-dihexadecyl-quinacridone (QA16C)の Ag(110) 表面への蒸着を行ったところ、その被覆率 により8種類の超構造が観察された。構造 I, II は、 密度が低く、STM でアルキル基が明確に観察された。 構造 III ~ VIII は、密度が高く、STM ではアルキル 基が観察されず、かつ1分子が占める面積がアルキ ル基を含むと考えると小さすぎる。これらのことか ら、構造 I, II では、アルキル基が基板上に寝ている が、その他の構造では部分的に基板から立ち上がっ ていると同定された。分子の各部分と基板および分 子同士の相互作用エネルギーを DFT 計算で求め、 各超構造のエネルギーを、一分子当たりと、単位面 積当たりでそれぞれ計算すると、単位面積当たりで 計算した結果では構造 II, III, VIII が最も安定になり、



ラメラ構造 アルキル鎖がまっすぐなので、エ ントロピー的に不利。しかし、基 板との相互作用が大きいので、エ ンタルピー的には有利。





ハニカム構造

アルキル基が基板上に立って、自 由に動けるのでエントロピー的に は有利。基板との相互作用が無い ので、エンタルピー的には不利。

図5. NDI-C_xの代表的超構造の分子模型

これはアニーリング後のSTM 観測と一致した。つ まり、炭素鎖が炭素1個分表面に立ち上がると、そ の分単位面積当たりに入ることができる quinacridinone コアの数が増えその分のエネルギーゲインと、 炭素鎖1個分のエネルギーロスがあり、そのバラン スで構造が決まっているわけである。この場合にも、 結局、相互作用のエネルギーだけを考慮するとうま く実験結果が説明できている。²²

N, N'-Dialkylnaphthalenediimide(NDI-C_x)の溶液 / HOPG 境界にできる超構造を STM と FM-AFM で観測したところ、側鎖の長さがC3,C4の時には、 ラメラ構造、C5~C12はハニカム構造、C13~ C18はラメラ構造と、劇的に超構造が変わる。この 場合には、上記の実験のように濃度や被覆率を変え ているわけでは無いので、同じ議論ができない。分 子力場計算の助けを得て、それぞれの超構造を同定 したところ、ラメラ構造ではアルキル鎖が表面に寝 ている構造、ハニカム構造はアルキル鎖が全て表面 から立ち上がった構造であることが分かった。もし も、アルキル鎖とHOPG 表面の相互作用が、イミ ド骨格と HOPG 表面の相互作用よりも安定なので あれば、全ての鎖長でラメラ構造になるだろうし、 逆であれば全てハニカム構造になる筈である。ゆえ に、この結果は、これまでに議論をされてきた、単 位面積当たりの吸着エネルギーでは説明がつかない。 そこで、エントロピーを考慮に入れてみた。ハニカ ム構造は、アルキル鎖が溶液中に出ているので、そ の自由度が高くエントロピー的に有利である。しか し、おそらく相互作用エネルギー的には不利である と考えられる。ラメラ構造では、HOPG との相互 作用エネルギーのゲインがあるが、コンフォメーシ ョンが固定されるのでエントロピー的に不利である。 こう考えても、鎖長が変わるに従い、ラメラからハ ニカム、もしくはハニカムからラメラへの一方向の 変化は説明がつくが、ラメラ - ハニカム - ラメラと いう複雑な変化は説明がつかない。直鎖アルキル鎖 のエントロピーを厳密に考えると、短い間は、鎖同 士がぶつかることにより排除される構造がある。こ れを理論的に数式化して、計算に入れると、超構造 の鎖長による変化をうまく説明できることが分かっ た。こうした超構造の決定におけるエントロピーの 非線形性の重要性は、他の分子系でもみられている と思われる。²³

(3)表面修飾によるカーボンナノチューブの電子 状態の制御

単一分子への3本以上の電極を結合する事が、単 一分子集積回路研究の重要なマイルストーンになる。 電極として金属を材料に用いるのは困難であろう。 金属あるいは無機半導体を材料として用いて分子レ ベルの大きさで安定な物は存在しない。唯一可能性 があるのが、カーボンナノチューブ(CNT)などの 炭素系ナノ材料である。CNTであれば、直径が1 nm 未満の物もあり、金属的電気特性を持つものも 有る。分子との共有結合も、可能で、高い電導性を 持っている。CNTには、様々な構造のものが有り (n,m)指数で特徴付けられるが、現在ではいくつか の(n,m)CNTは、純粋な形で得ることもできるよ うになっている。

CNTと有機分子を用いた電気特性で、注意深く ないといけないのは、CNTの表面に有機分子など が吸着しただけで、電子状態が変わることや、その 接合面で様々な複雑な電子特性が現れることである。 吸着により、半導体・金属転移や、整流性等が現れ ることを既に報告している。²⁴²⁶

単一分子集積回路の研究は、合成化学、自己組織 化、単一分子計測、炭素ナノ材料の科学と、非常に 幅広い分野の専門家の共同研究が必要であり、物質 科学の総力戦と言っても差し支えない。その先には、 われわれがまだ見たことの無い新天地が広がってい ることと思う。

参考文献

- Park, H.; Park, J.; Lim, A. K. L.; Anderson, E. H.; Alivisatos, A. P.; McEuen, P. L. *Nature* 2000, 407, 57.
- (2) Liang, W. J.; Shores, M. P.; Bockrath, M.; Long, J. R.; Park, H. *Nature* 2002, *417*, 725.
- (3) Kiguchi, M.; Kaneko, S. *ChemPhysChem* **2012**, *13*, 1116.
- (4) Migliore, A.; Nitzan, A. ACS Nano 2011, 5, 6669.
- (5) Bogani, L.; Wernsdorfer, W. Nat. Mater. 2008, 7, 179.
- (6) Ishikawa, N. Polyhedron 2007, 26, 2147.
- (7) Ishikawa, N.; Sugita, M.; Ishikawa, T.; Koshihara,
 S.; Kaizu, Y. J. Phys. Chem. B 2004, 108, 11265.

- (8) Ishikawa, N.; Sugita, M.; Ishikawa, T.; Koshihara,
 S.; Kaizu, Y. J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 8694.
- (9) Komeda, T.; Isshiki, H.; Liu, J.; Zhang, Y.-F.; Lorente, N.; Katoh, K.; Breedlove, B.; Yamashita, M. *Nat. Commun.* 2011, *2*, 217.
- (10) Katoh, K.; Isshiki, H.; Komeda, T.; Yamashita, M. *Chem. Asia J.* 2012, *7*, 1154.
- (11) Urdampilleta, M.; Klyatskaya, S.; Cleuziou, J. P.; Ruben, M.; Wernsdorfer, W. *Nat. Mater.* 2011, *10*, 502.
- (12) Candini, A.; Klyatskaya, S.; Ruben, M.; Wernsdorfer, W.; Affronte, M. Nano Lett. 2011, 11, 2634.
- (13) Tanaka, D.; Inose, T.; Tanaka, H.; Ishikawa, N.; Ogawa, T. *Chem. Commun.* **2012**, 7796.
- (14) Schmaus, S.; Bagrets, A.; Nahas, Y.; Yamada, T.; Bork, A.; Bowen, M.; Beaurepaire, E.; Evers, F.; Wulfhekel, W. *Nat. Nanotechnol.* 2011, *6*, 185.
- (15) Bosch-Serrano, C.; Clemente-Juan, J.; Coronado,
 E.; Gaita-Ariño, A.; Palii, A.; Tsukerblat, B. *ChemPhysChem* 2012, DOI: 10.1002/cphc. 201200383.
- (16) Miyamachi, T.; Gruber, M.; Davesne, V.; Bowen, M.; Boukari, S.; Joly, L.; Scheurer, F.; Rogez, G.; Yamada, T.; Ohresser, P.; Beaurepaire, E.; Wulfhekel, W. *Nat. Commun.* **2012**, *3*, 938.
- (17) Lu, Y. H.; Lent, C. Phys. Chem. Chem. Phys. 2011, 13, 14928.
- (18) Mali, K.; Adisoejoso, J.; Ghijsens, E.; De Cat, I.; De Feyter, S. Acc. Chem. Res. 2012, DOI: 10.1021/ar200342u.
- (19) Lei, S.; Tahara, K.; De Schryver, F.; Van der Auweraer, M.; Tobe, Y.; De Feyter, S. Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 2008, 47, 2964.
- (20) Kampschulte, L.; Werblowsky, T.; Kishore, R.; Schmittel, M.; Heckl, W.; Lackinger, M. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 8502.
- (21) Carlos-Andres, P.; Massimo, B.; Thomas, B.; Paolo, S. *Adv. Mater.* **2009**, *21*.
- (22) Cun, H.; Wang, Y.; Du, S.; Zhang, L.; Zhang, L.; Yang, B.; He, X.; Wang, Y.; Zhu, X.; Yuan, Q.; Zhao, Y.-P.; Ouyang, M.; Hofer, W.; Pennycook,

S.; Gao, H.-j. Nano Lett. 2012, 12, 1229.

- (23) Miyake, Y.; Nagata, T.; Tanaka, H.; Yamazaki, M.; Ohta, M.; Kokawa, R.; Ogawa, T. *ACS Nano* **2012**, *6*, 3876.
- (24) Tanaka, H.; Yajima, T.; Matsumoto, T.; Otsuka, Y.; Ogawa, T. *Adv. Mater.* **2006**, *18*, 1411.

(25) Subramaniam, C.; Sreeprasad, T. S.; Pradeep,

T.; Kumar, G. V. P.; Narayana, C.; Yajima, T.; Sugawara, Y.; Tanaka, H.; Ogawa, T.; Chakrabarti, J. *Phys. Rev. Lett.* **2007**, *99*.

(26) Tanaka, H.; Hong, L.; Fukumori, M.; Negishi, R.; Kobayashi, Y.; Tanaka, D.; Ogawa, T. *Nanotechnology* 2012, 23.

